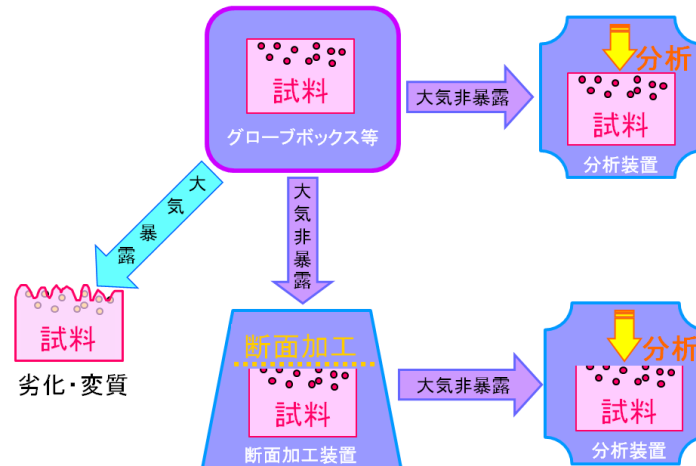


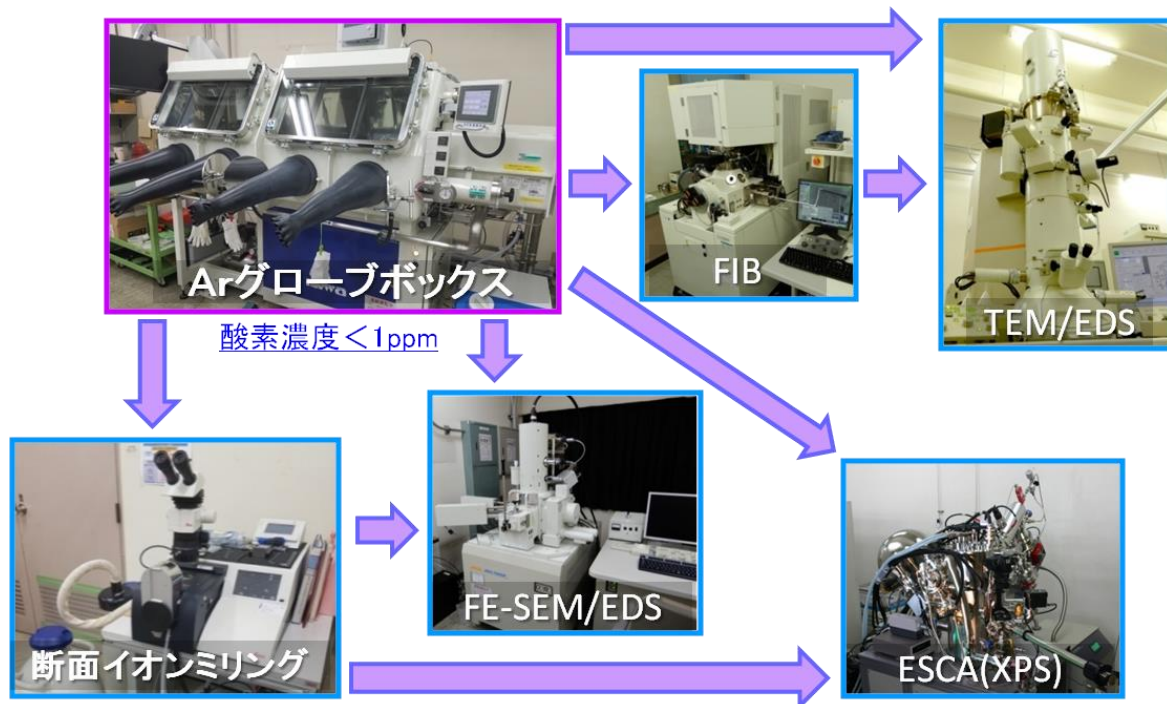
## 【技術資料】大気非暴露分析 - 表面・局所分析 -

### 概要

大気下で変質・構造変化し易い材料(例えば電池材料、有機 EL 材料、触媒関連材料)を試料前処理から分析まで一貫して、大気非暴露環境下で分析するための設備を備えています。



前処理設備としてグローブボックス内での切断や FIB、断面イオンミリング(CP)による断面作成が可能です。また、分析装置は TEM/EDS、FE-SEM/EDS、ESCA(XPS)が対応しています。



適用分野：フラットパネルディスプレイ、電池・半導体材料、組成分析、形態観察・測定、表面、結晶構造解析  
 キーワード：易酸化材、その他有機製品、その他無機製品、断面、大気非暴露、大気遮断グローブボックス、  
 TEM、SEM、EDS、ESCA、XPS、FIB、CP、断面イオンミリング、クライオ CP